

# 光链路损耗测试仪&分布式光纤传感系统



**TranCT-215** 可用于光链路传输损耗测量，具有超高的损耗测试动态范围和灵敏度，超高的空间分辨率和损耗定位精度。该系统可选配光纤传感功能软件，从而使该系统实现多通道同时采集、分布式光纤应变及温度测量功能。

## 产品特点:

### □ 损耗测试功能

- 测试长度最长50m
- 空间分辨率高达20um
- 回损测试灵敏度可达-130dB
- 回损测试动态范围80dB
- 插损测试动态范围15dB
- 可提供全套硬、软件解决方案

### □ 传感测试功能

- 测试长度最长100m
- 空间分辨率最高可达1mm@50m
- **可提供全套硬、软件解决方案**

## 典型应用:

- 光子芯片传输损耗测量
- 芯片内损耗事件定位分析
- 芯片内光链路延时测量
- 光链路损耗分析
- 分布式光纤应变、温度传感
- 3D光纤形状传感系统研发

技术指标	单位	TranCT-215
------	----	------------

### 损耗测试功能

中心波长	nm	1550
扫描范围	nm	40
波长精度	pm	0.1
光链路测试长度	m	<b>50</b>
空间分辨率	um	20
回损测量范围	dB	0~-125
回损灵敏度	dB	-130
回损动态范围	dB	80
回损测量分辨率	dB	0.1
回损测量精度	dB	±0.5
插损动态范围	dB	15
插损分辨率	dB	0.1
插损精度	dB	±0.2
测试频率	Hz	1

### 传感测试功能

空间分辨率	mm	<b>1@50m, 10@100m</b>
应变测量范围	uε	±15000
应变测量精度	uε	±5
温度测量范围	°C	-200~1200
温度测量精度	°C	±0.2
测试通道数	-	标准1, 可定制
单次测试时间	s	5



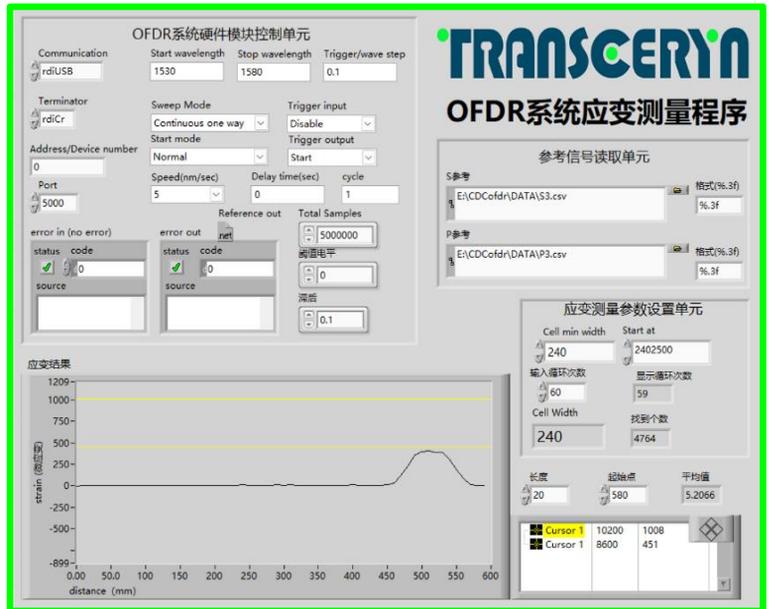
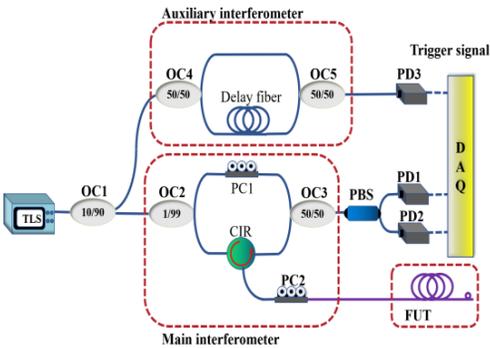
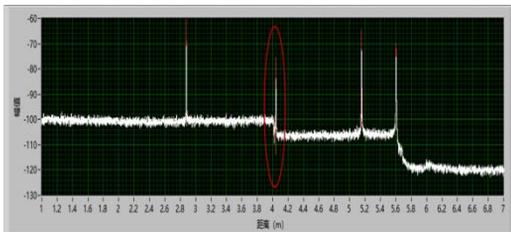
# OFDR系统搭建整套硬、软件解决方案

我们能够为客户提供系统搭建硬件清单、软件算法及源代码、系统调试及验证等整套的技术解决方案。

**硬件方案特点：**核心器件选择、关键光路搭建、整机系统集成

**软件方案特点：**提供核心算法及程序源代码、交互界面辅助设计、未来软件升级

## 损耗测试功能



## 传感测试功能

